Environmental Protection Agency

Pt. 98, Subpt. I, Table I-3

| TABLE I-2 TO SUBPART I OF PART 98—EXAMPLES OF FLUORINATED GHGS USED BY |
|--|
| THE ELECTRONICS INDUSTRY |

| Product type | Fluorinated GHGs and fluorinated heat transfer fluids used during manufacture |
|--------------|---|
| Electronics | $\begin{array}{l} CF_{4,} \ C_2F_6, \ C_3F_8, \ c\text{-}C_4F_8, \ c\text{-}C_4F_8, \ C_4F_6, \ C_5F_8, \ CHF_3, \ CH_2F_2, \ NF_3, \ SF_6, \ and \ fluorinated \ HTFs \ (CF_3\text{-}(O\text{-}CF(CF_3)\text{-}CF_2)_n\text{-}(O\text{-}CF_2)_n\text{-}O\text{-}CF_3, \ C_nF_{2n+2}, \ C_nF_{2n+1}, \ C_nF_{2n-1}, \ C_nF_{2n-1}, C_nF_{2n-1})_{3N}). \end{array}$ |

[77 FR 10381, Feb. 22, 2012]

TABLE I-3 TO SUBPART I OF PART 98—DEFAULT EMISSION FACTORS $(1-U_{ij})$ for Gas Utilization Rates (U_{ij}) and By-Product Formation Rates (B_{ijk}) for Semiconductor Manufacturing for 150 mm and 200 mm Wafer Sizes

| Type/ Sub- CF4 | | | | | Dre | Process Gas i | i se | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|--------------------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| | | | a no | | 2.0.2 | | | NE | сE | ц С | ц С | |
| - 1 E - | 4 C2F6 | ⁶ CHF3 | CH2F2 | C2HF5 | CH3F | C3F8 | C4F8 | NF3 | \mathbf{br}_6 | C4F6 | C5F8 | C4F8U |
| | | | E | TCHINC | ETCHING/ WAFER CLEANING | R CLE | ANING | | | | | |
| 1-U _i 0.81 | 1 0.72 | 2 0.50 | 0.13 | 0.064 | 0.51 | NA | 0.14 | 0.19 | 0.55 | 0.17 | 0.072 | NA |
| BCF ₄ NA | A 0.10 | 0 0.085 | 0.079 | 0.077 | NA | NA | 0.11 | 0.0040 | 0.13 | 0.13 | NA | NA |
| BC ₂ F ₆ 0.046 | 46 NA | A 0.030 | 0.025 | 0.024 | NA | NA | 0.037 | 0.025 | 0.11 | 0.11 | 0.014 | NA |
| BC4F ₆ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC4F8 NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC ₃ F ₈ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC ₅ F ₈ 0.0012 | 12 NA | A 0.0012 | NA | NA | NA | NA | 0.0086 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF ₃ 0.10 | 0 0.047 | 47 NA | 0.049 | ΝA | 0.0034 | ΝA | 0.040 | ΝA | 0.0012 | 0.066 | 0.0039 | NA |
| | | | | CHA | CHAMBER CLEANING | LEANI | NG | | | | | |
| | | | | In sit | In situ plasma cleaning | a cleani | gu | | | | | |
| 1-U _i 0.92 | 2 0.55 | 5 NA | NA | NA | NA | 0.40 | 0.10 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.14 |
| BCF ₄ NA | A 0.21 | 1 NA | NA | NA | NA | 0.20 | 0.11 | 0.050 | NA | NA | NA | 0.13 |
| BC ₂ F ₆ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.045 |
| BC ₃ F ₈ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | Remo | Remote plasma cleaning | a clean | ing | | | | | |
| 1-U _i NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.018 | NA | NA | NA | NA |
| BCF ₄ NA | A NA | A NA | ΝA | NA | NA | NA | NA | 0.015 | NA | NA | NA | NA |
| BC ₂ F ₆ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC ₃ F ₈ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | In sit | In situ thermal cleaning | ul clean | ing | | | | | |
| 1-U _i NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCF ₄ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC ₂ F ₆ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC ₃ F ₈ NA | A NA | A NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

[78 FR 68221, Nov. 13, 2013]